

地方創生センター2号館機器使用料一覧

通し番号	機器名称	管理責任者	単位	研究員単価	研究員以外の単価
1	ディスク型手動粉碎機	柴山	時	50	100
2	堅型粉碎機	柴山	時	50	100
3	ロール型磁選機	柴山	時	0	30
4	空気テーブル	柴山	時	0	50
5	日東高圧 卓上型0.2tオートクレーブ HC-276 20MPa	柴山	時	50	100
6	レーザーゼータ電位計	柴山	時	70	200
7	エリーズ非鉄金属選別器ECS 1222 ラボモデル	柴山	時	30	100
8	紫外可視近赤外分光光度計	柴山	時間	350	700
9	波長分散小型蛍光X線分析	柴山	個	200	400
10	付属消耗品:成形リング	柴山	個	60	60
11	イオンクロマトグラフ ICS-3000型	柴山/芳賀	時	100	300
12	蒸留水製造装置 RFD240NA	柴山	ℓ	0	10
13	超純水製造装置 RFU464CA	柴山	ℓ	10	30
14	湿式高磁力磁選機 HIW L-4ラボモデル	柴山	時	50	200
15	湿式粉碎機(アトライト) MA01SC型	柴山	時	50	200
16	粒度分布測定装置 MT3300EX-SDU	柴山/芳賀	時	100	300
17	拡散反射測定ユニット60φ積分球付属装置 ISR-3100(UV-3600用)	柴山	時	100	300
18	卓上型高周波ビードサンプラー	柴山/芳賀	試料	100	200
19	EXAFS装置	高崎	回	1100	3300
20	ICP発光分光分析装置	芳賀	時	700	2100
21	直流安定化電源	高崎	時	0	100
22	高周波誘導加熱装置	齋藤嘉一	回	100	250
23	AOカーシートフロッタ(A0/ビ・A0の普通紙)	高崎	枚	600	1800
	AOカーシートフロッタ(A1の普通紙)	高崎	枚	300	900
	AOカーシートフロッタ(A0/ビ・A0の光沢紙薄口)	高崎	枚	900	2500
	AOカーシートフロッタ(A1の光沢紙薄口)	高崎	枚	450	1250
	AOカーシートフロッタ(A0/ビ・A0、用紙持ち込み時)	高崎	枚	500	1600
	AOカーシートフロッタ(A1の普通紙、用紙持ち込み時)	高崎	枚	250	800
24	真空アーク溶解炉	肖	個	100	250
25	紫外可視分光光度計	高崎	時間	100	300
26	金属用ラボカッター	高崎	時間	100	300
27	施盤	高崎	時間	100	300
28	電磁ふるい振とう機	高崎	時間	100	300
29	多層構造膜作製装置	長谷川	日	500	1500
30	多元合金膜作製装置	長谷川	日	500	1500
31	純水製造装置	長谷川	ℓ	10	30
32	精密天秤	長谷川	時間	0	50
33	高真空熱処理装置	長谷川	時	50	150
34	カー効果磁化・磁区観察装置	長谷川	時間	50	150
35	パルス磁場印加装置	長谷川	時間	50	150
36	垂直磁場磁気力顕微鏡装置	長谷川	時間	50	150
37	熱ドリフト補正型磁気力顕微鏡装置	長谷川	時間	50	150
38	高真空型走査プローブ顕微鏡	吉村	時	50	150
39	高感度磁化測定装置	吉村	時	70	200
40	液体窒素	吉村	ℓ	100	150
41	表面粗さ測定装置	吉村	分	1	3
42	多目的X線回折装置	吉村	時	70	200
43	偏光顕微鏡	吉村	時	0	100
44	均温熱処理装置	吉村	時	50	150
45	磁気記憶装置材料分析・評価システム	吉村	日	1000	5000
46	粉末X線回折装置	大川・吉村	時	100	300
	粉末X線回折装置	大川・吉村	枚	10	20
47	形状測定レーザーマイクロスコープ VK-X200/210SP	吉村	分	1	3
48	振動試料型磁力計	吉村	時	50	100
49	走査電子顕微鏡(SEM)	齋藤嘉一	時	100	250
50	カーボンコーター	齋藤嘉一	回	50	150
51	イオンコーター	齋藤嘉一	回	50	150
52	薄膜X線回折装置	齋藤嘉一	時	100	250
53	システム実体顕微鏡	齋藤嘉一	時	0	100
54	微小空間組織構造評価装置(FE-SEM) JSM-7800F	齋藤嘉一	時	500	1500
55	GCマス装置	寺境	時	300	700
56	大気型走査プローブ顕微鏡	寺境	時	50	150
57	示差熱天秤 TG-DTA	小笠原	時	50	150
58	小型精密切断機	高橋護	時	0	0
59	超高温小型真空・雰囲気炉ニュートリアンパスカル40	林正彦	時	50	150
60	プラスチック種類判別計	松村	時	50	150
61	PCRサーマルサイクラー	久場・小泉	時	10	50
62	電界放射型走査電子顕微鏡	林	時	70	200
63	卓上型プラズマ発光分光分析装置	林・村上英樹	時	600	2000
64	ナノ粒子粒径解析/ゼータ電位計	小笠原	分	1	3
65	Agilent 630 FT-IR システム	小笠原	分	2	5
66	金属分散度測定装置 BEL-METAL-1SPA1	進藤	時	50	100